

---

---

**Analyse par microfaisceaux — Lignes  
directrices pour la mesure d'orientation  
par diffraction d'électrons rétrodiffusés**

*Microbeam analysis — Guidelines for orientation measurement using  
electron backscatter diffraction*

**PDF – Exonération de responsabilité**

Le présent fichier PDF peut contenir des polices de caractères intégrées. Conformément aux conditions de licence d'Adobe, ce fichier peut être imprimé ou visualisé, mais ne doit pas être modifié à moins que l'ordinateur employé à cet effet ne bénéficie d'une licence autorisant l'utilisation de ces polices et que celles-ci y soient installées. Lors du téléchargement de ce fichier, les parties concernées acceptent de fait la responsabilité de ne pas enfreindre les conditions de licence d'Adobe. Le Secrétariat central de l'ISO décline toute responsabilité en la matière.

Adobe est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated.

Les détails relatifs aux produits logiciels utilisés pour la création du présent fichier PDF sont disponibles dans la rubrique General Info du fichier; les paramètres de création PDF ont été optimisés pour l'impression. Toutes les mesures ont été prises pour garantir l'exploitation de ce fichier par les comités membres de l'ISO. Dans le cas peu probable où surviendrait un problème d'utilisation, veuillez en informer le Secrétariat central à l'adresse donnée ci-dessous.



**DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT**

© ISO 2009

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'ISO à l'adresse ci-après ou du comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office  
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20  
Tel. + 41 22 749 01 11  
Fax + 41 22 749 09 47  
E-mail [copyright@iso.org](mailto:copyright@iso.org)  
Web [www.iso.org](http://www.iso.org)

Publié en Suisse

**Sommaire**

Page

<b>Avant-propos</b> .....	<b>iv</b>
<b>Introduction</b> .....	<b>v</b>
<b>1</b> <b>Domaine d'application</b> .....	<b>1</b>
<b>2</b> <b>Références normatives</b> .....	<b>1</b>
<b>3</b> <b>Termes et définitions</b> .....	<b>1</b>
<b>4</b> <b>Équipement EBSD</b> .....	<b>7</b>
<b>5</b> <b>Conditions de fonctionnement</b> .....	<b>8</b>
<b>6</b> <b>Étalonnages requis pour l'indexation des clichés EBSP</b> .....	<b>13</b>
<b>7</b> <b>Procédure d'analyse</b> .....	<b>17</b>
<b>8</b> <b>Incertitude de mesure</b> .....	<b>18</b>
<b>9</b> <b>Présentation des résultats d'analyse</b> .....	<b>19</b>
<b>Annexe A</b> (informative) <b>Principe de l'EBSD</b> .....	<b>20</b>
<b>Annexe B</b> (normative) <b>Préparation de l'échantillon pour l'EBSD</b> .....	<b>21</b>
<b>Annexe C</b> (informative) <b>Brève introduction à la cristallographie, à l'indexation du cliché EBSP, et autres informations utiles pour l'EBSD</b> .....	<b>27</b>
<b>Bibliographie</b> .....	<b>44</b>